УДК 621.372.8:535 РЕФРАКТОМЕТРИЯ ИЗВЕСТКОВО-НАТРИЕВОГО СТЕКЛА

С. О. ПАРАШКОВ¹, Н. И. СТАСЬКОВ², Е. В. ТРЕТЬЯК² ¹Белорусско-Российский университет ²Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова Могилев, Беларусь

Известково-натриевое стекло (SLG) миллиметровой толщины широко используется в качестве подложек для нанесения нанометровых пленок. При определении оптических характеристик пленок по измеренным спектрам отражения R и пропускания T важно знать показатели преломления nи поглощения k подложки. Трудности определения n и k стекла SLG создает тонкий (до 1 мкм) слой, в который проникает расплавленное олово [1]. Спектры T и R поляризованного света подложек измеряли на спектрометре PHOTON RT в диапазоне длин волн от 250 до 826 нм с шагом 2 нм при угле падения света $\theta = 10^{\circ}$. Эллипсометрический анализ (SE) проводили на эллипсометре UVISEL2. Углы ψ и Δ измеряли при $\theta = 55^{\circ}$ в диапазоне λ от 206 до 826 нм с шагом 1 нм. Схемы измерения спектров T (1, 3), R (2, 4), ψ и Δ (2, 4) показаны на рис.1, a.



Рис. 1. Схемы измерения спектров *T*, *R*, ψ и Δ (*a*), рассчитанные *n* и *k* объема SLG, «оловянного» слоя и стекла cSLG (δ), функции ε стекла SLG (ϵ); *l* – эксперимент; *2* – теория

При малых углах θ широкие пучки лучей 2 и 4 миллиметровой плоскопараллельной пластиной не разделяются. Разделение узких пучков 2 и 4 достигается при использовании метода SE при углах $\theta > 55^{\circ}$ (фото над лучами). Для некогерентной ($D \gg \lambda$) стеклянной пластины сантиметровой толщины D [2] коэффициент поглощения α , см⁻¹, рассчитывают по следующим формулам:

$$\alpha = -D^{-1} \ln \left\{ \left(\left[\left(1 - R_{01} \right)^4 + 4R_{01}^2 T^2 \right]^{0.5} - \left[1 - R_{01} \right]^2 \right) 0, 5R_{01}^{-2} T^{-1} \right\};$$
(1)

$$\alpha = 4\pi k (\lambda 10^{-7})^{-1}, \tag{2}$$

где R_{01} – отражательная способность на границе «воздух – стекло».

В этом методе проблематично измерить R_{01} . После определения α спектр k пластины определяют по формуле (2). По спектрам *Te* и *Re* пластины SLG (D = 0,12 см), измеренным при $\theta = 10^{\circ}$, аналитически [3] рассчитали (см. рис. 1, δ) ее n и k.

По спектрам ψ и Δ (см. схему 4 на рис. 1, a; $\theta = 55^{\circ}$) рассчитали d и спектры nTin и kTin «оловянного» слоя. Затем эти спектры уточнялись для минимизации отклонения рассчитанных T_t , R_t и измеренных Te, Re. Спектры nTin и kTin «оловянного» слоя (d = 86 нм) приведены на рис.1, δ . Кривые ncSLG, kcSLG на этом рисунке соответствуют оптическим характеристикам стекла Clear SLG из [4]. Спектр k пластины SLG (D = 0,16 см) из [1] расположен между кривыми kcSLG и kSLG. Спектр показателя преломления «оловянного» слоя из [1] (d = 982,8 нм) расположен рядом с кривой nTin. На рис. 1, eпредставлена интерполяция классической дисперсионной функцией (2) диэлектрической проницаемости ε спектра $n^2 - k^2$ (1) стекла SLG.

Эллипсометрический анализ пленок на известной подложке упрощается при выборе измерений по схеме 2 (см. рис.1, a). В этом случае подложка рассматривается как неограниченная среда без «оловянного» слоя. Удовлетворительная корреляция спектров n и k, полученных в разных работах (см. рис. 1, δ), свидетельствует о малом влиянии параметров «оловянного» слоя на спектры R и T.

Работа выполнена в рамках Государственной программы научных исследований Республики Беларусь «1.15 Фотоника и электроника для инноваций».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Synowicki, R. A. Optical properties of soda-lime float glass from spectroscopic ellipsometry / R. A. Synowicki, B. D. Johs, A. C. Martin // Thin Solid Films. -2011. - T. 519, No 9. -C. 2907-2913.

2. Schroder, D. K. Semiconductor material and device characterization / D. K. Schroder // John Wiley & Sons. – 2015.

3. Spectrophotometry of Layers on Plane Parallel Substrates / A. B. Sotsky [et al.] // Optics and Spectroscopy. – 2020. – T. 128, № 8. – C. 1155–1166.

4. **Rubin, M.** Optical properties of soda lime silica glasses / M. Rubin // Solar energy materials. – 1985. – T. 12, № 4. – C. 275–288.

325